MICROCRE 研润光机

YR PrismScan 632棱镜耦合仪632.8nm干式耦合M-line测试仪

产品资料摘要

型号 YR PrismScan 632 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
光学玻璃与晶体	K9 / BK7、N-BK7、熔融石英、石英玻璃、高硼硅玻璃、冕牌玻璃、火石玻璃、蓝宝石、YAG、GGG、$LiNbO_3$、$LiTaO_3$、CaF_2、MgF_2、ZnS、ZnSe 等透明或低吸收块体材料。
光学薄膜与功能薄膜	SiO_2、Si_3N_4、AlN、AlScN、Al_2O_3、TiO_2、Ta_2O_5、HfO_2、MgF_2、ZrO_2、ZnO、ITO、AZO、FTO、PMMA、光刻胶、树脂及其他透明或弱吸收单层介质薄膜。
平面光波导与集成光子	玻璃、聚合物、SiO_2、Si_3N_4、AlN、AlScN、$LiNbO_3$、TiO_2 等平面波导及介质波导结构。
1、测量原理	棱镜耦合 / M-line 测量
2、标准工作波长	632.8 nm（He-Ne）

参数项目	原站列示数值或说明
3、光源	He-Ne 激光器
4、偏振方式	TE/TM 双偏振切换
5、扫描方式	自动连续角度扫描
6、探测方式	光电探测
7、块体折射率测量	支持
8、单层薄膜折射率、厚度联合分析	支持
9、有效折射率 Neff 计算	支持
10、折射率测量精度	±0.001
11、折射率重复性	≤ 0.0005
12、薄膜膜厚测量范围	0.5 μm ~ 150 μm
13、薄膜分析能力	支持单层薄膜 n / d 联合分析

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/PrismScan632.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。